微电子专业基础实验作业

PB21511897 李霄奕

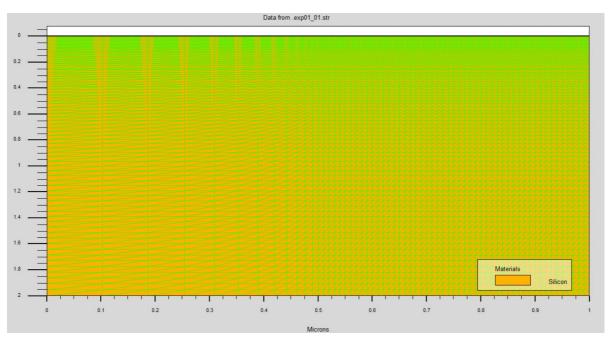
工艺部分

实验1

作业1

题目:图 9 中的网格何处密?何处疏?两处在器件模拟时不同在哪?

答案:

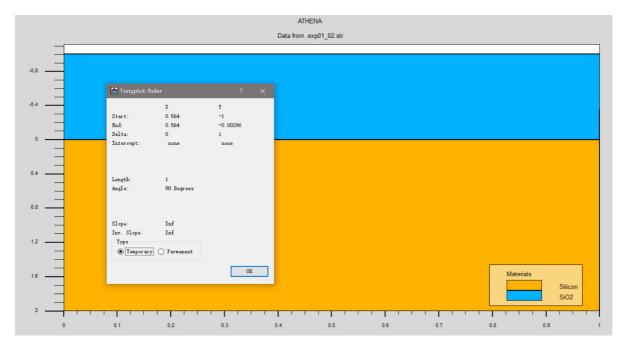


可以看出,网格左下稀疏,右上密集,两处在器件模拟时不同的地方在于,网格越密集,模拟的单元越小越密集,模拟的结果越准确,但是也越慢

作业2

题目:请测量一下图 12 中淀积氧化层的厚度是多少?

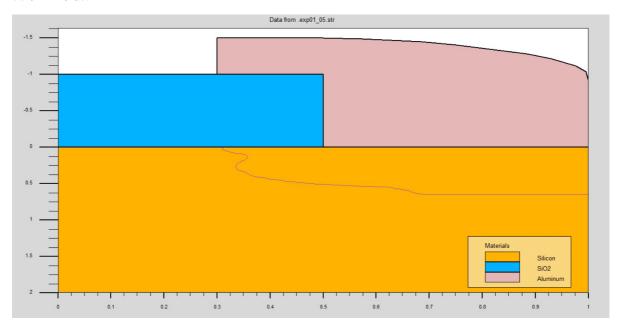
答案:



运用尺子工具和目测, $\Delta Y=1$,所以,氧化层 SiO_2 的厚度为 $1\mu m$

题目:请给出金属淀积后和刻蚀后的器件结构图。

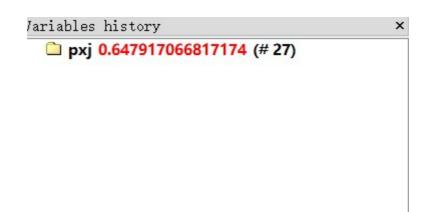
答案: 如图所示



作业4

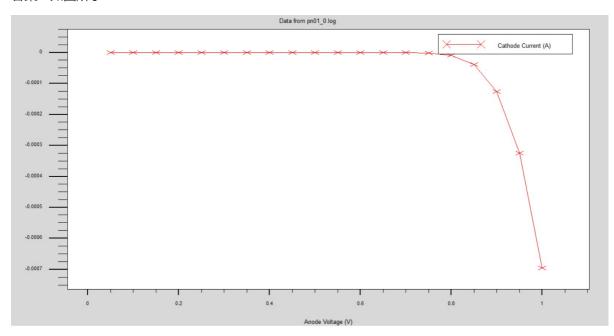
题目: X=0.8μm 处的结深是多少?

答案: $pxj = 0.6479 \mu m$



题目:给出你自己编程绘出的 pn 结 I-V 特性图。

答案: 如图所示



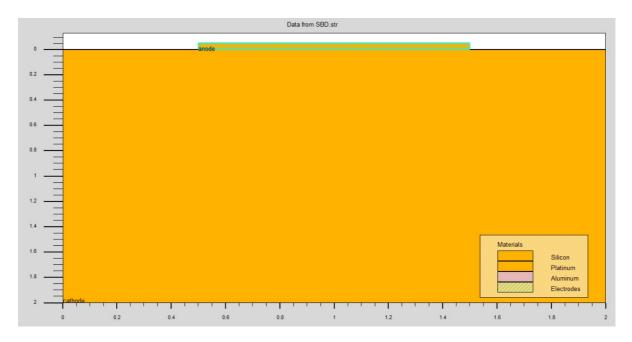
实验2

作业1

题目:请描述所仿真的器件结构(如掺杂浓度,厚度)。

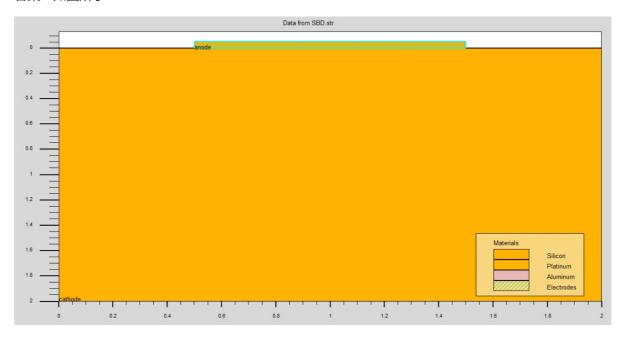
答案: 该器件从下往上一共有2层材料

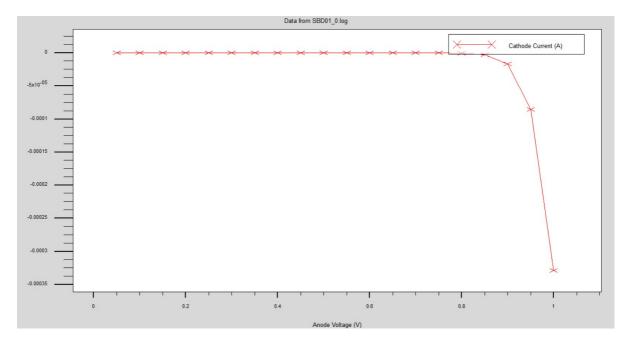
- 硅, (100)晶面, 磷掺杂的浓度为 $1.0 \times 10^{18} cm^{-3}$
- 铂,厚度为0.05μm



题目:请给出所设计器件的:纵向结构图, I-V 特性图。

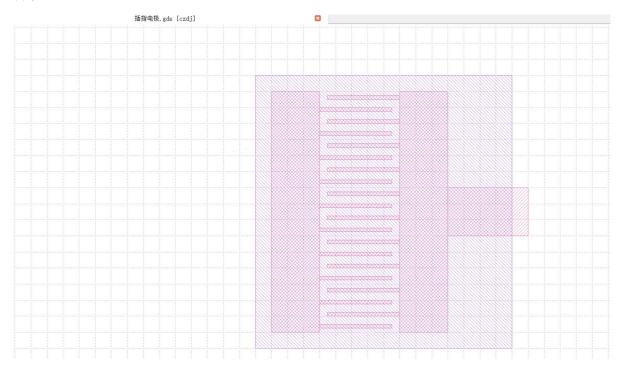
答案: 如图所示





题目:请给出所设计器件的横向结构图 (即版图)

答案:



该器件为一个两层的插指电极